



Warszawa, 27.10.2017 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek” w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.”

Zamawiający:

Nazwa firmy: InPhoTech Sp. z o.o.

Adres: ul. Dzika 15/12, 00-172 Warszawa

NIP: 9512303553

REGON: 142233406

Email: zamowienia@inphotech.pl

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zamówienie realizowane w ramach projektu „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek.”

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów. Dostarczone materiały powinny zapewnić wykonanie trzech typów światłowodów mikrostrukturalnych (dla trzech poziomów domieszkowania GeO₂ rdzeni) (tabela nr 1)
- 2) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów. Dostarczone materiały powinny zapewnić wykonanie światłowodów w technologii włókien mikrostrukturalnych (tabela nr 2)

Całość przedmiotu zamówienia ma być wykonana do końca trwania Projektu tj. 30.09.2018 r.

Kody CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane



InPhoTech Sp. z o.o.

 ul. Dzika 15/12, 00-172 Warszawa

 22 409 91 45

 inphotech@inphotech.pl

Tabela nr 1

Materiały eksploatacyjne i substraty do technologii wytwarzania światłowodów domieszkowanych:

RODZAJ MATERIAŁU	CHARAKTERYSTYKA	ILOŚĆ
Kapilary ze szkła krzemionkowego o zwiększonej dokładności wykonania	- czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, - zwiększona dokładność wykonania, - \varnothing zew.= 1 mm (dokładność $\pm 0,002$ mm), - współczynnik wypełnienia: 0,5 (dokładność $\pm 0,05$), - długość = 1 000 mm (dokładność ± 1 mm).	1584
Pręciki ze szkła krzemionkowego o zwiększonej dokładności wykonania	- czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, - zwiększona dokładność wykonania, - \varnothing zew.= 1 mm (dokładność $\pm 0,002$ mm), - długość = 1000mm (dokładność ± 1 mm).	3168
Pręciki ze szkła krzemionkowego domieszkowane GeO₂ - typ 1	- czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, - domieszkowanie na poziomie 4,0 - 6,0 % mol GeO ₂ , - \varnothing zew.=1 mm (dokładność $\pm 0,005$ mm), - długość 1000mm (dokładność ± 1 mm), - współczynnik wypełnienia: powyżej 0,5 - profil współczynnika załamania: skokowy, - fluktuacje profilu współczynnika załamania: nie większe niż 1%.	77
Pręciki ze szkła krzemionkowego domieszkowane GeO₂ - typ 2	- czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, - domieszkowanie na poziomie poniżej 4,0 % mol GeO ₂ , - \varnothing zew.= 1 mm (dokładność $\pm 0,005$ mm), - długość 1000mm (dokładność ± 1 mm), - współczynnik wypełnienia: powyżej 0,5 - profil współczynnika załamania: skokowy, - fluktuacje profilu współczynnika załamania: nie większe niż 2%.	77
Pręciki ze szkła krzemionkowego domieszkowane GeO₂ - typ 3	- czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, - domieszkowanie na poziomie powyżej 6,0 % mol GeO ₂ , - \varnothing zew.= 1 mm (dokładność $\pm 0,005$ mm), - długość 1000mm (dokładność ± 1 mm), - współczynnik wypełnienia powyżej: 0,5 - profil współczynnika załamania: skokowy, - fluktuacje profilu współczynnika załamania: nie większe niż 2%.	77



Gazy techniczne do technologii światłowodów	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość formowania prętów domieszkowanych, w szczególności osadzania warstw - możliwość monitorowania prędkości linii technologicznej - wykorzystywane w utrzymaniu linii technologicznych - wykorzystywane w utrzymaniu wyciągarek światłowodowych - wykorzystywane do zasilania palników 	Ilość niezbędna do prowadzenia prac badawczych nad wykonaniem trzech typów światłowodów (dla trzech poziomów domieszkowania GeO ₂ rdzeni).
Związki chemiczne do technologii światłowodów	<ul style="list-style-type: none"> - związki chemiczne wysokiej czystości stanowiące substraty syntetycznych szkielek kwarcowych i High Silica - związki chemiczne do czyszczenia oraz trawienia szkła - podwyższona czystość 	Ilość niezbędna do prowadzenia prac badawczych nad wykonaniem trzech typów światłowodów (dla trzech poziomów domieszkowania GeO ₂ rdzeni).
Materiały niezbędne do wykonania pokryć ochronnych na wykonanych światłowodach	<ul style="list-style-type: none"> - ciekłe polimery i kompozyty powłok ochronnych światłowodów oraz związków chemicznych do ich modyfikacji 	Ilość niezbędna do prowadzenia prac badawczych nad wykonaniem trzech typów światłowodów (dla trzech poziomów domieszkowania GeO ₂ rdzeni).

Tabela nr 2

Materiały eksploatacyjne i substraty do technologii wytwarzania światłowodów mikrostrukturalnych:

RODZAJ MATERIAŁU	CHARAKTERYSTYKA	ILOŚĆ
Kapilary ze szkła krzemionkowego o zwiększonej dokładności wykonania	<ul style="list-style-type: none"> - czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, - zwiększona dokładność wykonania, - Øzew.= 1 mm (dokładność ± 0,002 mm), - współczynnik wypełnienia: 0,5 (dokładność ± 0,05), - długość = 1 000 mm (dokładność ± 1mm). 	1368



<p>Pręciki ze szkła krzemionkowego o zwiększonej dokładności wykonania</p>	<ul style="list-style-type: none"> - czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, - zwiększona dokładność wykonania, - $\varnothing_{zew.} = 1 \text{ mm}$ (dokładność $\pm 0,002 \text{ mm}$), - długość = 1000mm (dokładność $\pm 1\text{mm}$). 	<p>2736</p>
<p>Pręciki ze szkła krzemionkowego domieszkowane GeO₂</p>	<ul style="list-style-type: none"> - czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, - domieszkowanie na poziomie poniżej 4,0 % mol GeO₂, - $\varnothing_{zew.} = 1 \text{ mm}$ (dokładność $\pm 0,005 \text{ mm}$), - długość 1000mm (dokładność $\pm 1\text{mm}$), - współczynnik wypełnienia: powyżej 0,5 - profil współczynnika załamania: skokowy, - fluktuacje profilu współczynnika załamania: nie większe niż 2%. 	<p>200</p>
<p>Gazy techniczne do technologii światłowodów</p>	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość formowania prętów domieszkowanych, w szczególności osadzania warstw - możliwość monitorowania prędkości linii technologicznej - wykorzystywane w utrzymaniu linii technologicznych - wykorzystywane w utrzymaniu wyciągarek światłowodowych - wykorzystywane do zasilania palników 	<p>Ilość niezbędna do prowadzenia prac badawczych nad wykonaniem światłowodów w technologii światłowodów mikrostrukturalnych.</p>
<p>Związki chemiczne do technologii światłowodów</p>	<ul style="list-style-type: none"> - związki chemiczne wysokiej czystości stanowiące substraty syntetycznych szkielek kwarcowych i High Silica - związki chemiczne do czyszczenia oraz trawienia szkła - podwyższona czystość 	<p>Ilość niezbędna do prowadzenia prac badawczych nad wykonaniem światłowodów w technologii światłowodów mikrostrukturalnych.</p>
<p>Materiały niezbędne do wykonania pokryw ochronnych na wykonanych światłowodach</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ciekłe polimery i kompozyty powłok ochronnych światłowodów oraz związków chemicznych do ich modyfikacji 	<p>Ilość niezbędna do prowadzenia prac badawczych nad wykonaniem światłowodów w technologii światłowodów mikrostrukturalnych.</p>





Uprzejmie prosimy o podanie całkowitego kosztu realizacji zamówienia (cena netto PLN)

Prosimy o przesyłanie szacowania wartości najpóźniej do dnia 06.11.2017 r. na adres mailowy: zamowienia@inphotech.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.



InPhoTech Sp. z o.o.

 ul. Dzika 15/12, 00-172 Warszawa

 22 409 91 45

 inphotech@inphotech.pl